

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年9月29日 (29.09.2005)

PCT

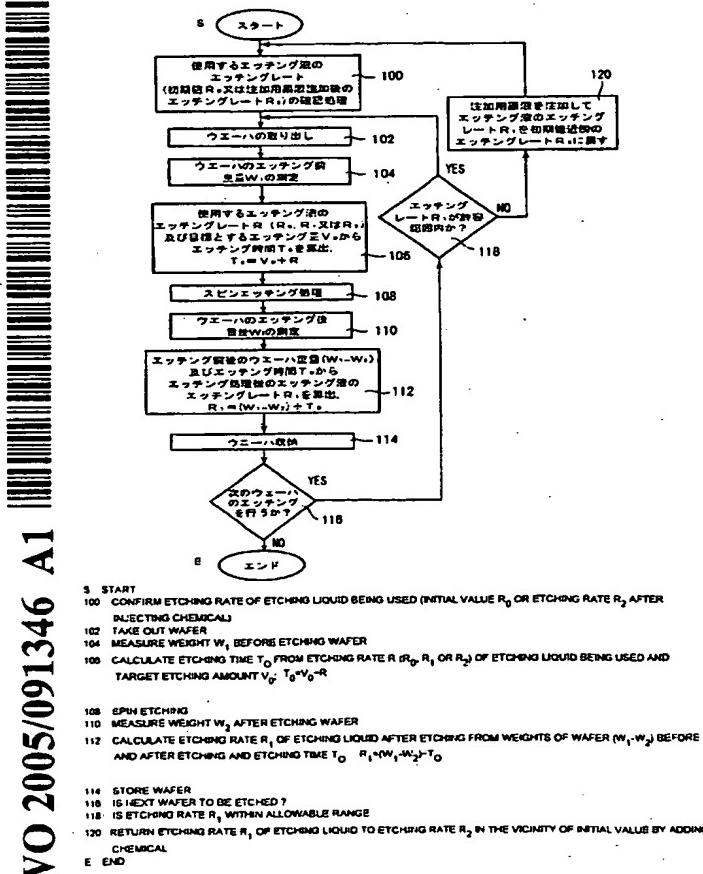
(10) 国際公開番号
WO 2005/091346 A1

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| (51) 国際特許分類 ⁷ : | H01L 21/306 | (72) 発明者; および |
| (21) 国際出願番号: | PCT/JP2004/003817 | (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 土屋 正人
(TSUCHIYA, Masato) [JP/JP]; 〒3703521 群馬県群馬郡群馬町棟高1909番地1 三益半導体工業株式会社 エンジニアリング事業部内 Gunma (JP). 小笠原 俊一 (OGASAWARA, Syunichi) [JP/JP]; 〒3703521 群馬県群馬郡群馬町棟高1909番地1 三益半導体工業株式会社 エンジニアリング事業部内 Gunma (JP). |
| (22) 国際出願日: | 2004年3月22日 (22.03.2004) | |
| (25) 国際出願の言語: | 日本語 | |
| (26) 国際公開の言語: | 日本語 | |
| (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三益半導体工業株式会社 (MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒3703531 群馬県群馬郡群馬町足門762番地 Gunma (JP). | | (74) 代理人: 石原 詔二 (ISHIHARA, Shoji); 〒1700013 東京都豊島区東池袋3丁目7番8号 若井ビル302号 Tokyo (JP). |

/統葉有/

(54) Title: SCHEDULE CONTROL METHOD IN SPIN ETCHING AND SPIN ETCHING SYSTEM

(54) 発明の名称: スピンエッティングにおける工程管理方法及びスピンエッティング装置



(57) Abstract: A schedule control method in spin etching and a spin etching system in which uniform etching amount can be realized when a wafer is etched under various conditions and etched wafers have a uniform thickness. Weight of a wafer is measured, before etching, on a 1/1000g basis and then specified etching is carried out at a spin etching section. Weight is measured again on a 1/1000g basis following a rinsing/drying process, an actual etching amount is calculated from the difference between weights before and after etching the wafer, and an etching rate of etching liquid is confirmed every time to control an etching time.

(57) 要約: 本発明は、さまざまな条件のウェーハでもエッティング処理でのエッティング量の均一化を実現できるとともにエッティング後のウェーハ間の厚さを均一にすることができるようにしたスピンエッティングにおける工程管理方法及びスピンエッティング装置を提供する。本発明は、まずエッティング処理する前にウェーハの重量測定を1/1000g単位で測定し、次にスピンエッティング部で所定のエッティング処理を行う。次いでウェーハのリシス乾燥処理の後に再度1/1000g単位での重量測定を行い、ウェーハのエッティング前後の差し引き重量から実際のエッティング量を算出しエッティング液のエッティングレートを毎回確認しエッティング時間を制御するようにした。

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日

2005年9月29日 (29.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号

WO 2005/091346 A1

(51) 国際特許分類⁷:

H01L 21/306

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/003817

(22) 国際出願日: 2004年3月22日 (22.03.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三益半導体工業株式会社 (MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒3703531 群馬県群馬郡群馬町足門762番地 Gunma (JP).

(72) 発明者; および

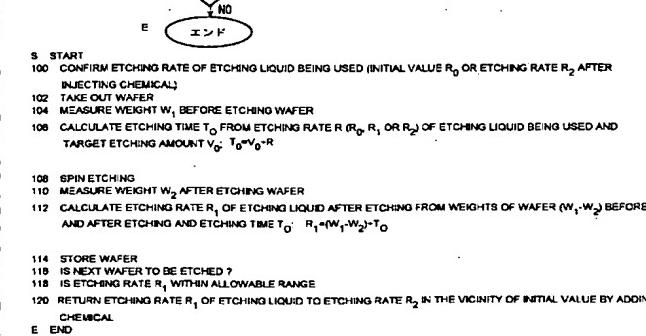
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 土屋 正人 (TSUCHIYA, Masato) [JP/JP]; 〒3703521 群馬県群馬郡群馬町棟高1909番地1 三益半導体工業株式会社 エンジニアリング事業部内 Gunma (JP). 小笠原俊一 (OGASAWARA, Syunichi) [JP/JP]; 〒3703521 群馬県群馬郡群馬町棟高1909番地1 三益半導体工業株式会社 エンジニアリング事業部内 Gunma (JP).

(74) 代理人: 石原 詔二 (ISHIHARA, Shoji); 〒1700013 東京都豊島区東池袋3丁目7番8号 若井ビル302号 Tokyo (JP).

/続葉有

(54) Title: SCHEDULE CONTROL METHOD IN SPIN ETCHING AND SPIN ETCHING SYSTEM

(54) 発明の名称: スピンエッティングにおける工程管理方法及びスピンエッティング装置



(57) Abstract: A schedule control method in spin etching and a spin etching system in which uniform etching amount can be realized when a wafer is etched under various conditions and etched wafers have a uniform thickness. Weight of a wafer is measured, before etching, on a 1/1000g basis and then specified etching is carried out at a spin etching section. Weight is measured again on a 1/1000g basis following a rinsing/drying process, an actual etching amount is calculated from the difference between weights before and after etching the wafer, and an etching rate of etching liquid is confirmed every time to control an etching time.

(57) 要約: 本発明は、さまざまな条件のウェーハでもエッティング処理でのエッティング量の均一化を実現できるとともにエッティング後のウェーハ間の厚さを均一にすることができるようとしたスピンエッティングにおける工程管理方法及びスピンエッティング装置を提供する。本発明は、まずエッティング処理する前にウェーハの重量測定を1/1000g単位で測定し、次にスピンエッティング部で所定のエッティング処理を行う。次いでウェーハのリシス乾燥処理の後に再度1/1000g単位での重量測定を行い、ウェーハのエッティング前後の差し引き重量から実際のエッティング量を算出しエッティング液のエッティングレートを毎回確認しエッティング時間を制御するようにした。

WO 2005/091346 A1



(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL,

SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。